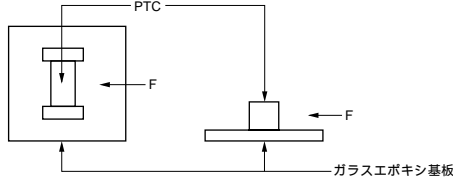


No.	項目	規格	試験方法															
1	抵抗値 (at 25)	定格値を満足すること。	周囲温度25 において、最大電圧3分印加後、室温(25)に2時間放置した後、1.5Vdc以下(測定電流10mA以下)の端子電圧を用いて測定する。															
2	端子電極固着力	端子電極の剥離または、その徴候は起きません。	EIAJ ET - 7403 第9項によります。 下記に示す試験治具にはんだ付けし、矢印Fの方向に5.0Nの力を加えます。 															
3	耐振性	外観に著しい異常はありません。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1)	JIS C 5102 8.2項によります。 試験治具にはんだ付けします。 振動 : 10 ~ 55 ~ 10Hz (約1分間) 全振幅 : 1.5mm 互いに垂直な3方向に2時間ずつ(計6時間)行います。															
4	はんだ付け性	端子電極の3/4以上に切目なくはんだが付着します。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1)	JIS C 5102 8.4項によります。 はんだ温度 : 230 ± 5 はんだ : H60AまたはH63A 浸漬時間 : 3 ± 0.5秒 浸漬位置 : 端子電極が隠れるまで。															
5	はんだ耐熱性	外観に著しい異常はありません。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1)	はんだ : H60AまたはH63A フラックス : 塩素含有0.2Wt%以下 クリームはんだ 予熱温度・時間 : 150 ± 5 3分 ピーク温度・時間 : 260 ± 5 10 ± 5秒 (リフロー) 使用基板 : ガラス布基材エポキシ樹脂 JIS C 6484															
6	温度サイクル	外観に著しい異常はありません。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1、2)	JIS C 5102 9.3項によります。 温度サイクル : 5回 <table border="1" data-bbox="973 1120 1356 1254"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度 ()</th> <th>時間 (分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>- 20 +0, - 3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>常温</td> <td>10 ~ 15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>+ 150 + 3, - 0</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>常温</td> <td>10 ~ 15</td> </tr> </tbody> </table>	段階	温度 ()	時間 (分)	1	- 20 +0, - 3	30	2	常温	10 ~ 15	3	+ 150 + 3, - 0	30	4	常温	10 ~ 15
段階	温度 ()	時間 (分)																
1	- 20 +0, - 3	30																
2	常温	10 ~ 15																
3	+ 150 + 3, - 0	30																
4	常温	10 ~ 15																
7	耐湿性	外観に著しい異常はありません。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1、2)	JIS C 5102 9.5項によります。 温度40 ± 2 、相対湿度90 ~ 95%の恒温恒湿槽に入れ、500 ± 8時間放置します。															
8	高温負荷	外観に著しい異常はありません。 25 抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にあります。(*1、2)	JIS C 5102 9.10項によります。 温度85 ± 5 の恒温槽に入れ、最大電圧を1000 ± 12時間印加します。															

(*1) 抵抗値測定は、1.5Vdc以下(測定電流10mA以下)の端子電圧を用いて行います。

試験後の抵抗値測定は、25 ± 2 中に2時間放置後行います。

(*2) 検知温度のずれは初期値 ± 1 以内にありま

2.端子電極固着力、3.耐振性評価時のはんだ付けは、標準ランド寸法のガラスエポキシ基盤に、「使用上の注意」に記載の弊社標準評価はんだを用い、標準のはんだ付け条件により行っています。